

日本産業規格作成審議経過報告書（確認）

1. 確認の申出を行う日本産業規格

JIS C 0806-6 自動実装部品のパッケージング—第6部：表面実装部品用バルクケースによるパッケージング 外 125 件（別紙 1 のとおり）

2. 確認の申出を行う日本産業規格に係る主務大臣

経済産業大臣専管

3. 確認の理由

別紙 1 の日本産業規格は、産業標準化法第 17 条の規定による見直し期限を 2020 年度に迎えるものであるが、認定産業標準作成機関として、関係各方面の意見を調査し検討した結果、現行の日本産業規格がなお適正であると認められることから、確認すべきものとして申出する。

4. 確認の申出を行う日本産業規格の作成及び審議に関する事項

(1) 認定産業標準作成機関名；一般財団法人日本規格協会（JSA）

(2) 法令上の区分；

産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項に基づく申出

(3) 産業標準作成委員会名；

電子分野産業標準作成委員会

(4) 産業標準作成委員会の構成表及び開催状況；

別紙 2 に記載のとおり。

(5) 作成審議経過

①確認に係る計画の審議；2019 年 12 月 27 日 産業標準作成委員会議決

②確認に係る日本産業規格一覧表の作成及び公表；2020 年 1 月 17 日から 2 月末（予定）まで JSA ウェブサイト掲載

③利害関係者の産業標準作成委員会への参加の確保；2020 年 1 月 17 日から 2 月末（予定）まで JSA ウェブサイト掲載（参加要望：無し）

④異議申立ての機会の確保；2020 年 1 月 17 日から 2 月末（予定）まで JSA ウェブサイト掲載（異議申立て：無し）

⑤確認の申出に係る審議；2020 年 2 月 21 日 産業標準作成委員会議決

⑥議事録及び委員会資料の公開；2020 年 2 月下旬（予定） JSA ウェブサイト掲載

以上

確認の申出を行う日本産業規格

No	規格番号	規格名称
1	C0806-6	自動実装部品のパッケージング—第6部：表面実装部品用バルクケースによるパッケージング
2	C2570-1	直熱形NTCサーミスター第1部：品目別通則
3	C2570-2	直熱形NTCサーミスター第2部：品種別通則—表面実装形NTCサーミスタ
4	C5005-2	品質評価システム—第2部：電子部品及び電子パッケージのための抜取検査方式の選択及び活用（統計的工品質限界の評価手順）
5	C5101-3	電子機器用固定コンデンサー第3部：品種別通則：表面実装用固定タンタル固体（MnO ₂ ）電解コンデンサ
6	C5101-3-1	電子機器用固定コンデンサー第3-1部：ブランク個別規格：表面実装用固定タンタル固体（MnO ₂ ）電解コンデンサ 評価水準E Z
7	C5101-4-1	電子機器用固定コンデンサー第4-1部：ブランク個別規格：アルミニウム非固体電解コンデンサー—評価水準E Z
8	C5101-4-2	電子機器用固定コンデンサー第4-2部：ブランク個別規格：アルミニウム固体（MnO ₂ ）電解コンデンサー—評価水準E Z
9	C5101-18-1	電子機器用固定コンデンサー第18-1部：ブランク個別規格：表面実装用固定アルミニウム固体（MnO ₂ ）電解コンデンサー—評価水準E Z
10	C5101-18-2	電子機器用固定コンデンサー第18-2部：ブランク個別規格：表面実装用固定アルミニウム非固体電解コンデンサー—評価水準E Z
11	C5101-20-1	電子機器用固定コンデンサー第20-1部：ブランク個別規格：表面実装用固定メタライズドポリフェニレンスルフィドフィルム直流コンデンサ 評価水準E Z
12	C5101-21-1	電子機器用固定コンデンサー第21-1部：ブランク個別規格：表面実装用固定積層磁器コンデンサ種類1 評価水準E Z
13	C5101-22-1	電子機器用固定コンデンサー第22-1部：ブランク個別規格：表面実装用固定積層磁器コンデンサ種類2 評価水準E Z
14	C5201-1	電子機器用固定抵抗器—第1部：品目別通則
15	C5201-9	電子機器用固定抵抗器—第9部：品種別通則：個別測定可能な表面実装用固定ネットワーク抵抗器
16	C5201-9-1	電子機器用固定抵抗器—第9-1部：ブランク個別規格：個別測定可能な表面実装用固定ネットワーク抵抗器—評価水準E Z
17	C5381-311	低圧サージ防護デバイス用部品—第311部：ガス入り放電管（GDT）の要求事項及び試験回路
18	C5381-312	低圧サージ防護デバイス用部品—第312部：ガス入り放電管（GDT）の選定及び適用基準
19	C5401-1	電子機器用コネクタ—製品要求事項—第1部：品目別通則
20	C5401-2	電子機器用コネクタ第2部：品種別通則—丸形コネクタ—品質評価付
21	C5401-2-001	電子機器用コネクタ第2-001部：丸形コネクタ—品質評価付—ブランク個別規格
22	C5401-3	電子機器用コネクタ第3部：品種別通則—角形コネクタ—品質評価付
23	C5401-3-001	電子機器用コネクタ第3-001部：角形コネクタ—品質評価付—ブランク個別規格
24	C5402-2-5	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第2-5部：導通及び接触抵抗試験—試験2e：コンタクトディスターバンス

25	C5402-4-1	電子機器用コネクタ試験及び測定—第4—1部：電圧ストレス試験—試験4 a：耐電圧
26	C5402-7-1	電子機器用コネクタ試験及び測定—第7—1部：衝撃試験（可動形コネクタ）—試験7 a：自由落下（繰返し）
27	C5402-8-1	電子機器用コネクタ試験及び測定—第8—1部：静的な力試験（固定形コネクタ）—試験8 a：静的な力，横方向
28	C5402-8-3	電子機器用コネクタ試験及び測定—第8—3部：静的な力試験（固定形コネクタ）—試験8 c：操作レバーの強度
29	C5402-9-1	電子機器用コネクタ試験及び測定—第9—1部：耐久試験—試験9 a：機械的動作
30	C5402-10-4	電子機器用コネクタ試験及び測定—第10—4部：インパクト試験（可動形部品），静的負荷試験（固定形部品），耐久試験及び過負荷試験—試験10 d：電氣的過負荷（コネクタ）
31	C5402-11-7	電子機器用コネクタ試験及び測定—第11—7部：耐候性試験—試験11 g：混合ガス流腐食
32	C5402-11-14	電子機器用コネクタ試験及び測定—第11—14部：耐候性試験—試験11 p：単一ガス流腐食
33	C5402-13-1	電子機器用コネクタ試験及び測定—第13—1部：機械的動作試験—試験13 a：結合力及び離脱力
34	C5402-14-2	電子機器用コネクタ試験及び測定—第14—2部：封止（気密性）試験—試験14 b：封止（気密性）—微小エアリーク
35	C5402-14-4	電子機器用コネクタ試験及び測定—第14—4部：封止（気密性）試験—試験14 d：浸せき—防水
36	C5402-14-5	電子機器用コネクタ試験及び測定—第14—5部：封止（気密性）試験—試験14 e：浸せき（減圧）
37	C5402-14-6	電子機器用コネクタ試験及び測定—第14—6部：封止（気密性）試験—試験14 f：インタフェーシャルシーリング
38	C5402-16-8	電子機器用コネクタ試験及び測定—第16—8部：コンタクト及びターミネーションの機械的試験—試験16 h：インシュレーショングリップの有効性（圧着接続）
39	C5402-16-9	電子機器用コネクタ試験及び測定—第16—9部：コンタクト及びターミネーションの機械的試験—試験16 i：接地コンタクトスプリングの保持力
40	C5402-16-13	電子機器用コネクタ試験及び測定—第16—13部：コンタクト及びターミネーションの機械的試験—試験16 m：ラッピングの巻き戻し，無はんだラッピング接続
41	C5402-17-1	電子機器用コネクタ試験及び測定—第17—1部：ケーブルクランプ試験—試験17 a：ケーブルクランプ強度
42	C5402-17-2	電子機器用コネクタ試験及び測定—第17—2部：ケーブルクランプ試験—試験17 b：ケーブルクランプ強度（ケーブルの回転）
43	C5402-17-4	電子機器用コネクタ試験及び測定—第17—4部：ケーブルクランプ試験—試験17 d：ケーブルクランプ強度（ケーブルのねじり）
44	C5402-23-4	電子機器用コネクタ試験及び測定—第23—4部：スクリーニング及びフィルタリング試験—試験23 d：時間領域での伝送線路の反射
45	C5412	高周波同軸C02形コネクタ
46	C5413	高周波同軸C03形コネクタ
47	C5414	高周波同軸C04形コネクタ
48	C5415	高周波同軸C05形コネクタ
49	C5419	高周波同軸C11形コネクタ
50	C5432	電子機器用丸形R01コネクタ

51	C5502	マイクロホン
52	C5569	録音再生機器における速さ変動の測定方法
53	C5602	電子機器用受動部品用語
54	C5610	集積回路用語
55	C5630-20	マイクロマシン及びMEMS—第20部：小型ジャイロ
56	C5750-2	ディペンダビリティ マネジメント—第2部：ディペンダビリティ マネジメントのための指針
57	C5750-3-4	ディペンダビリティ マネジメント—第3-4部：適用の指針—ディペンダビリティ要求事項仕様書作成の指針
58	C5750-3-5	ディペンダビリティ管理—第3-5部：適用の指針—信頼性試験条件及び統計的方法に基づく試験原則
59	C5750-4-3	ディペンダビリティ マネジメント—第4-3部：システム信頼性のための解析技法—故障モード・影響解析（FMEA）の手順
60	C5750-4-4	ディペンダビリティ マネジメント—第4-4部：システム信頼性のための解析技法—故障の本解析（FTA）
61	C5871	干渉フィルタ試験方法
62	C5912	波長スイッチ通則
63	C5920-1	光伝送用パワー制御受動部品—第1部：通則
64	C5925-1	光伝送用WDMデバイス—第1部：通則
65	C5925-3	シングルモード光ファイバビッグテール形C/LバンドWDMデバイス
66	C5925-4	シングルモード光ファイバビッグテール形980/1550nmWWDMデバイス
67	C5930-1	光伝送用スイッチ—第1部：通則
68	C5942	再生用及び記録用半導体レーザ通則
69	C5943	再生用及び記録用半導体レーザ測定方法
70	C5976	F07形2心光ファイバコネクタ
71	C5987	F18形光ファイバコネクタ
72	C6011-1	電子装置用きょう体の試験方法—第1部：屋内設置のキャビネット、ラック、サブラック及びシャシの耐環境性能の試験及び安全性の評価
73	C6011-2	電子装置用きょう体の試験方法—第2部：キャビネット及びラックの耐震試験方法
74	C6011-3	電子装置用きょう体の試験方法—第3部：キャビネット及びサブラックの電磁シールド性能試験方法
75	C6012-3-100	電子機器用の機械的構造—482.6mm（19in）シリーズの機械的構造寸法—フロントパネル、サブラック、シャシ、ラック及びキャビネットの基本寸法
76	C6114-1	光変調器モジュール通則
77	C6114-2	光変調器モジュール測定方法
78	C6115-1	pin-FETモジュール通則
79	C6115-2	pin-FETモジュール測定方法
80	C6122-1-1	光増幅器—測定方法—第1-1部：パワーパラメータ及び利得パラメータ—光スペクトラムアナライザ法
81	C6122-1-2	光増幅器—測定方法—第1-2部：パワーパラメータ及び利得パラメータ—電気スペクトラムアナライザ法

82	C6122-3	光増幅器—測定方法—第3部：雑音指数パラメータ
83	C6122-3-2	光増幅器—測定方法—第3-2部：雑音指数パラメータ—電気スペクトラムアナライザ試験方法
84	C6122-5-1	光ファイバ増幅器—測定方法—第5-1部：光反射率パラメータ測定方法—光スペクトラムアナライザを用いた測定方法
85	C6122-11-1	光増幅器—測定方法—第11-1部：偏波モード分散パラメータ—ジョーンズマトリクス固有値解析（JME）法
86	C6180	レーザ出力測定方法
87	C6181	レーザ放射パワー及びエネルギー測定用検出器，測定器及び測定装置
88	C6182	レーザビーム用光パワーメータ試験方法
89	C6443	普通級炭素系可変抵抗器
90	C6444	電子機器用炭素系混合体可変抵抗器—特性Y，W及びUC
91	C6445	巻線形可変抵抗器
92	C6461	電子機器用可変コンデンサ品目別通則
93	C6462	電子機器用可変コンデンサの試験方法
94	C6560	単頭プラグ・ジャック
95	C6831	光ファイバ心線
96	C6850	光ファイバケーブル通則
97	C6870-3-10	光ファイバケーブル—第3-10部：屋外ケーブル—ダクト・直埋用及びラッシング形架空用光ファイバケーブル品目別通則
98	C6870-3-20	光ファイバケーブル—第3-20部：屋外ケーブル—自己支持形架空用光ファイバケーブル品目別通則
99	C9914	オーディオ，ビデオ，情報及び通信技術機器—環境配慮設計
100	C60068-2-20	環境試験方法—電気・電子—第2-20部：試験—試験T—端子付部品のはんだ付け性及びはんだ耐熱性試験方法
101	C60068-2-45	環境試験方法—電気・電子—耐溶剤性（洗浄溶剤浸せき）試験方法
102	C61280-2-8	光ファイバ通信サブシステム試験方法—Q値測定を用いた低ビット誤り率の決定法
103	C61280-2-9	光ファイバ通信サブシステム試験方法—高密度波長分割多重システムの光信号対雑音比測定
104	C61280-2-11	光ファイバ通信サブシステム試験方法—光信号品質評価のための強度ヒストグラム評価を用いた平均化Q値測定
105	C61280-4-4	光ファイバ通信サブシステム試験方法—第4-4部：ケーブル設備及びリンク—既設リンクの偏波モード分散測定
106	C61281-1	光ファイバ通信サブシステム通則
107	C61300-2-2	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-2部：繰返しかん合試験
108	C61300-2-12	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-12部：落下衝撃試験
109	C61300-2-24	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-24部：応力印加によるセラミック割りスリーブのスクリーニング試験
110	C61300-2-40	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-40部：SM調心円筒形斜めPC端面光ファイバコネクタプラグの挿入損失スクリー

		ニング試験
111	C61300-2-41	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-41部：SM調心円筒形直角PC端面光ファイバコネクタプラグの挿入損失スクリーニング試験
112	C61300-2-44	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-44部：光ファイバランプ強度試験—繰返し曲げ
113	C61300-2-46	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-46部：湿熱サイクル試験
114	C61300-3-6	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-6部：反射減衰量測定
115	C61300-3-21	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-21部：切替時間測定
116	C61300-3-26	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-26部：光ファイバとフェルール軸との角度ずれの測定
117	C61300-3-30	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-30部：多心光ファイバコネクタ用フェルールの研磨角度及び光ファイバ位置測定
118	C61300-3-38	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-38部：群遅延、波長分散及び位相リップルの測定
119	C61300-3-50	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-50部：光スイッチのクロストーク測定
120	C62024-1	高周波誘導部品—電気的特性及び測定方法—第1部：ナノヘンリー範囲の表面実装インダクタ
121	C62025-1	高周波誘導部品—非電気特性及び測定方法—第1部：電子機器及び通信機器用表面実装固定インダクタ及びフェライトビーズ
122	C62137-1-1	表面実装技術—はんだ接合部耐久性試験方法—第1-1部：引きはがし強度試験方法
123	C62137-1-2	表面実装技術—はんだ接合部耐久性試験方法—第1-2部：横押しせん断強度試験方法
124	C62137-4	電子実装技術—第4部：エリアアレイ形表面実装部品のはんだ接合部耐久性試験方法
125	C62448	マルチメディアのシステム及び機器—マルチメディアの電子出版及び電子書籍—電子出版のための共通フォーマット
126	C62739-1	溶融鉛フリーはんだを用いたウェーブソルダリング装置の侵食試験方法—第1部：表面処理を施さない金属材料の侵食試験方法

1. 電子分野産業標準作成委員会の構成表

	氏名	所属	種別
(委員長)	波多腰 玄一	早稲田大学	中立者
(委員)	天野 佑基	総務省 国際戦略局 通信規格課 専門職	中立者
	石井 紀彦	日本放送協会	使用者
	河村 真紀子	主婦連合会	使用者
	渋谷 隆	株式会社白山	生産者
	諏訪 正樹	KOA 株式会社	生産者
	内藤 恵美子	公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会	使用者
	平本 俊郎	東京大学	中立者
	藤井 哲郎	東京都市大学	中立者
	松井 隆	日本電信電話株式会社	使用者
(関係者)	根上 雄二	経済産業省産業技術環境局国際電気標準課 課長補佐	—
	山本 克己	経済産業省産業技術環境局国際電気標準課 課長補佐	—
	米田 竜司	経済産業省産業技術環境局国際電気標準課 課長補佐	—
(事務局)	中川 梓	一般財団法人日本規格協会	—
	山本 久義	一般財団法人日本規格協会	—
	清水 祐貴	一般財団法人日本規格協会	—

2. 開催状況

開催年月日（議決日）	委員会区分	出席者数又は回答者数（名）
2019年12月27日	書面審議	10/10
2020年2月21日	書面審議	10/10